

名称：上海贝岭股份有限公司可靠性实验室

地址：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼

注册号：CNAS L23589

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 07 月 10 日 截止日期：2031 年 07 月 09 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项 目 / 参 数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
未分组						
1	电子元器件	1	预处理（PC）	非密封表贴器件可靠性试验前的预处理 JESD22-A113I-2020 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10	不做电参数测试； 只测：温度（50~180）℃；相对湿度≤98%RH	2025-07-10
				非密封表面贴装器件(SMD)的湿度/回流敏感度分类 J-STD-020F-2022 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	不做电参数测试； 只测：温度（50~180）℃；相对湿度≤98%RH	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2:A1	不做电参数测试； 只测：温度	2025-07-10



No. CNAS L23589

第 1 页 共 7 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2:A1	（50~180）℃；相对湿度≤98%RH 不做电参数测试；只测：温度（50~180）℃；相对湿度≤98%RH	2025-07-10
				稳态温湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D. 01-2021 4. 1, 4. 2, 4. 3. 4. 4	不做电参数测试；只测：温度（50~180）℃；湿度≤98%RH；电压≤1500V	2025-07-10
		2	稳态温度湿度偏置寿命试验（THB）	基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2:A2	不做电参数测试；只测：温度（50~180）℃；湿度≤98%RH；电压≤1500V	2025-07-10
				稳态温湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D. 01-2021 4. 1, 4. 2, 4. 3. 4. 4	不做电参数测试；只测：温度（50~180）℃；湿度≤98%RH；电压≤1500V	2025-07-10
		3	高温高湿反偏试验（H3TRB）	基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2:A2 alt	不做电参数测试；只测：温度（50~180）℃；湿度≤98%RH；电压≤1500V	2025-07-10



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	高加速应力试验（HAST）	高加速温湿度应力试验（HAST） JESD22-A110E.01-2021 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	不做电参数测试； 只测：温度（105~140）℃； 湿度：（65~100）%RH；电压≤150V	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2:A2	不做电参数测试； 只测：温度（105~140）℃； 湿度：（65~100）%RH；电压≤150V	2025-07-10
		5	高压蒸煮试验（AC）	加速耐湿性-无偏压高压蒸煮试验 JESD22-A102E-2015 4.1, 4.3	不做电参数测试； 只测：温度（105~140）℃； 湿度（65~100）%RH	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2 A3	不做电参数测试； 只测：温度（105~140）℃； 湿度（65~100）%RH	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2 A3 alt	不做电参数测试； 只测：温度（105~140）℃； 湿度（65~100）%RH	2025-07-10
		6	无偏置高加速	加速耐湿性-无偏置高加速应力试验 JESD22-A118B.01-	不做电参数测试；	2025-07-10



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			应力试验 (UHASt)	2021 4.1, 4.2, 4.3	只测:温度 (105~140)℃; 湿度(65~100) %RH	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, A3	不做电参数测试; 只测:温度 (105~140)℃; 湿度(65~100) %RH	
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2, A3	不做电参数测试; 只测:温度 (105~140)℃; 湿度(65~100) %RH	
		7	高温湿热试验 (THT)	稳态温湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D. 01-2021 4.1, 4.2, 4.3. 4.4	不做电参数测试; 只测:温度 (50~180)℃;湿 度≤98%RH;	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, A3	不做电参数测试; 只测:温度 (50~180)℃;湿 度≤98%RH;	
		8	温度循环试验 (TC)	温度循环试验 JESD22-A104F. 01-2023 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8	不做电参数测试; 只测:温度(- 65~150)℃	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求	不做电参数测试;	



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, A4	只测:温度 (-65~150) °C	
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2, A4	不做电参数测试; 只测:温度 (-65~150) °C	2025-07-10
		9	间歇工作寿命 (IOL)	半导体器件的环境试验方法第 1 部分:试验方法 1000 至 1999 MIL-STD-750-1Bw/CHANGE 2-2023 方法 1037.3	不做电参数测试; 只测:电压: (0~60) V; 电流: (0.01~120) A	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2, A5	不做电参数测试; 只测:电压: (0~60) V; 电流: (0.01~120) A	2025-07-10
		10	高温存储寿命 (HTSL)	高温贮存寿命试验 JESD22-A103E. 01-2021 4.1	不做电参数测试; 只测:温度≤280 °C	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, A6	不做电参数测试; 只测:温度≤280 °C	2025-07-10
		11	高温加速寿命试验 (HTOL)	温度、偏置和工作寿命 JESD22-A108G-2022 4, 5	不做电参数测试; 只测: 温度 (30~260) °C; 电压≤150V	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, B1	不做电参数测试; 只测: 温度 (30~260)	2025-07-10



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					℃；电压≤150V	
		12	早期失效率试验（ELFR）	温度、偏置和工作寿命 JESD22-A108G-2022 4, 5	不做电参数测试； 只测： 温度（30~260）℃；电压≤150V	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用集成电路应力试验鉴定要求 AEC-Q100-Rev-J-2023 表格 2, B2	不做电参数测试； 只测： 温度（30~260）℃；电压≤150V	2025-07-10
				早期寿命失效率 AEC - Q100-008 REV-A-2003	不做电参数测试 只测： 温度（30~260）℃；电压≤150V	2025-07-10
		13	高温反偏试验（HTRB）	温度、偏置和工作寿命 JESD22-A108G-2022 4, 5	不做电参数测试； 只测： 温度（30~200）℃；电压≤3000V	2025-07-10
				半导体器件环境试验方法第 1 部分：试验方法 1000 至 1999 MIL-STD-750-1Bw/CHANGE 2-2023 方法 1038.5	不做电参数测试； 只测：试验条件 A	2025-07-10
				半导体器件环境试验方法第 1 部分：试验方法 1000 至 1999 MIL-STD-750-1Bw/CHANGE 2-2023 方法 1039.4	不做电参数测试； 只测：试验条件 A	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2, B1	不做电参数测试； 只测： 温度（30~200）℃；电压≤3000V	2025-07-10



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	高温栅偏试验 (HTGB)	温度、偏置和工作寿命 JESD22-A108G-2022 4, 5	不做电参数测试； 只测：温度 (30~200)℃；电 压≤3000V	2025-07-10
				基于失效机理的汽车应用分立半导体应力试验鉴定要求 AEC-Q101-Rev-E-2021 表格 2, B2	不做电参数测试； 只测：温度 (30~200)℃；电 压≤3000V	2025-07-10



在线扫码获取验证